研究速報

結晶格子を基準としたリニアエンコーダー

A linear encoder using a crystal as a reference

星 泰 雄^{*}·河 岸 孝 昌^{*}·川 勝 英 樹^{*} Yasuo HOSHI, Takayoshi KAWAGISHI and Hideki KAWAKATSU

1. はじめに

走査型プローブ顕微鏡 (SPM: scanning probe microscope) の技術は、物性の測定だけでなく原子・分子を操作する超 微細加工技術への応用も盛んであり、半導体プロセスや生 体分子を扱う研究者からも注目を集めている.このような サブナノメータの観察・加工を再現性よく行うには、プロ ーブと試料の相対位置を正確に把握する必要がある.現在 はレーザー干渉計を用いる方法が一般的であるが、筆者ら は比較的小さな機構ですむ方法として、結晶格子を基準と して変位を測定するリニアエンコーダを検討している.基 本構想を図1 (a) に示す.テーブルに結晶を貼付し、SPM により検出する結晶の周期性から変位量を測定する.

本報では SPM として摩擦顕微鏡¹⁾ を用いている. これ はカンチレバーの先端にプローブをつけ,カンチレバーの 変形からプローブ-試料間に働く力を検出するものである. カンチレバーの変形は,レーザーをカンチレバーにあて, 反射光を4分割フォトダイオードで受ける光テコにより, たわみおよびねじれとして検出する.カンチレバーのたわ みはプローブを試料に押し付ける力を,ねじれはプローブ-試料間に働く摩擦力を表していると考えられる.

典型的なプローブの動きと、それに対応するねじれ信号 を同図(b)に示す.プローブ先端は試料上の一点に停留 するため、走査につれてカンチレバーのねじれが増加して ゆき、ある限界値を超えたとき急激な動きで次の停留点へ プローブ先端が移動する.このジャンプは一方向に走査し つづけている間はほぼ規則的に観察されるので、この信号 を微分することにより結晶格子の周期性を反映するパルス を発生することができる.

摩擦顕微鏡のこのようなスティック・スリップ挙動は, 発明者である Mate らが高配向性グラファイト(HOPG: high-

*東京大学生産技術研究所 マイクロメカトロニクス国際研究 センター



Fig. 1 (a) Schematic drawing of a linear encoder based on frictional force microscopy. (b) Regularity of a crystal is observed as a 'stick-slip' motion of the tip end. A big stick of the tip is observed just after the change in the scanning direction. However, in the rest part, good regularity of the saw-toothed signal is observed.

52卷9号(2000.9)

ly oriented pyrolytic graphite) で示したのを初めとして、さ まざまな試料について報告されており^{2)~7)},理論的な解析 も試みられている^{8)~9)}.しかし、これらの検討は主にプロ ーブを試料に押し付ける力の影響について論じられており、 走査速度を上げた場合の挙動の変化について論じたものは 少ない. Mateらは走査速度4 nm/sから400 nm/sまでで観 察を行い、観察像の速度依存性は特になかったと報告して いる.トライボロジーの分野では、摩擦顕微鏡を用いて数 μ m/sの走査速度で解析が行われているが^{10)~15)}、主として 摩擦力の大きさに注目しており、結晶格子レベルの分解能 に対する速度の影響を検討した例はわずかである^{11),15)}.

本報では,摩擦顕微鏡の走査速度が1µm/sを越えるような場合に,雲母およびHOPGの結晶格子を大気中で観察できる速度限界について検討した.

2. 実験方法

主な実験条件を表1に示す. 雲母および HOPG の劈開 した表面を摩擦顕微鏡により大気中で観察した. 通常の観 察ではカンチレバーのたわみを一定に保つ制御を行なう が,ここではカンチレバーの変形を積極的に得るためほと んどこの制御はかけていない. 観察に用いたカンチレバー は窒化シリコン製,幅20 µm,長さ200 µmの短冊形であ り,22 kHz のたわみ固有振動を持っている. カンチレバ ーの変形を検出する4分割フォトダイオードおよびアンプ の帯域は DC ~ 800 kHz (-3 dB) なので,十分にカンチレ バーの動きを捉えることができる.

3. 実験結果および考察

雲母の観察結果を図2に示す. 走査速度が1.5 μm/s 未 満の場合は図2(a)および図2(b) に示すように雲母結

Table 1Experimental condition. Cleaved mica and highly oriented
pyrolytic graphite (HOPG) were observed using a friction
force microscope. In all cases, the tip was brought into con-
tact with the sample and very slow control of repulsive force
was selected.

Cantilever width	20 µm
Cantilever length	200 µm
Cantilever material	Si ₃ N ₄
Atmosphere	Room temperature In ambient
Tip velocity	0.1~1.6 μm/s for mica 0.1~23 μm/s for HOPG

晶の周期性を反映する 0.55 nm 間隔の規則正しい鋸波が観察される.しかし,走査速度が 1.5 µm/s を超えるとこの 周期性が不安定となる.図2(c)のように鋸波が観察さ れる場合でも,その間隔は 3.3 nm であり,図2(a)およ び図2(b)で観察された周期性の「読み飛ばし」が起こ っていることを示している.筆者らはカンチレバーを押し 付ける力が強すぎるのがこの原因の一つではないかと考 え,押し付け力を 10 nN から 100 nN までの範囲で変化さ せて同様の実験を試みたが、「読み飛ばし」が始まる速度 と押し付け力との明確な相関は見られなかった.また,押 し付け力が 100 nN を超えると試料の磨耗が顕著となるた め、それ以上の押し付け力では実験を行っていない.

以上の実験から、大気中の雲母結晶を摩擦顕微鏡で観察 する場合は、プローブー試料間の境界条件が走査速度の限 界を決めることがわかった. 雲母が親水性であることから、 境界面に水分を含む吸着物がプローブの動きを拘束してい ると推察される. 雲母を高速で観察する場合は、真空中で 行なう等の配慮が必要である.

HOPGの観察結果を図3に示す. グラファイト結晶の周 期性に相当する約 0.22 nm 間隔の鋸波が走査速度 10 μm/s



Fig. 2 Velocity dependence of a torsion signal in the cases of observing mica. The pitch of saw-toothed signal is about 0.5 nm corresponding to atomic periodicity of mica in cases where the tip velocity is (a) 0.55μ m/s and (b) 1.1μ m/s, and about 3 nm in the case where the tip velocity is (c) 1.6μ m/s.

以上でも観察される. 雲母と異なりグラファイトは疎水性 なので, プローブが試料表面に拘束されず比較的自由に動 けるためと考えられる. 図3(c)では, 走査に起因する 鋸波の上に約400 kHzの周期的な信号を識別できる. これ はカンチレバーのねじれ固有振動である.

カンチレバーの振動特性を調べた結果を図4に示す. 試 料接触時と非接触時で特性が変わるため,それぞれの場合 についてたわみ信号およびねじれ信号の周波数特性を示し ている.たわみの共振周波数は非接触時には22kHzであ るが,接触時には95kHzに変化する.一方,ねじれの共 振周波数は接触時/非接触時とも417kHzである.

プローブを走査しているときは、これらの信号に加え、 観察している結晶格子の周期性を反映する周波数がねじれ 信号の周波数特性に現れる. 図5は走査速度が 11 μ m/s お よび 23 μ m/s の場合について、ねじれ信号の波形とたわ み・ねじれ信号それぞれの周波数特性を調べたものであ る. 走査速度が 11 μ m/s の場合、ねじれ信号に現れる試料 の周期性は約 50 kHz であり(図5 (c))、観察される波形 もきれいな鋸波である(図5 (a)). 図5 (c) の 95 kHz 付 近に観察される小さな盛り上がりはたわみ固有振動とねじ れ信号との間に若干の相互干渉があることを示している. 走査速度が23 μm/sとなって試料の周期性がたわみ固有振動とほぼ等しくなると、ねじれ信号の波形はかなり乱れており、試料の周期性による加振がたわみ固有振動を増大させていることを推察できる.さらに走査速度を上げて試料の周期性がねじれ固有振動の417 kHzに対応するまでの範囲で変化させたが、安定した鋸波は観察されなかった.

以上の結果から, HOPG を摩擦顕微鏡で観察する場合 は、カンチレバーの機械的特性が走査速度の限界を決める ことがわかった.走査速度をさらに上げるためには、共振 周波数が高くバネ定数の小さいカンチレバーが必要であ る.例えば共振周波数が1GHzのカンチレバーを用いて HOPGを観察する場合,界面の影響がなければ走査速度を 250 mm/sまで上げられることになる.

4.まとめ

劈開した雲母及び HOPG を大気中で摩擦顕微鏡により 観察し、次のような結果を得た.

 マイカでは、走査速度が1µm/sを超えると結晶周期 の読み飛ばしが始まる.



Time

Fig. 3 Velocity dependence of a torsion signal in the case of observing HOPG. The pitch of saw-toothed signal is about 0.2 nm corresponding to atomic periodicity of HOPG in all cases. A small wave at about 400 kHz in frequency is recognized clearly at tip velocity of (c) over 10μ m/s.



Fig. 4 Frequency characteristics of the cantilever. A peak at 22 kHz in freestanding condition was detected from the spectrum of the bending signal of the cantilever ((b)). The peak moved to about 95 kHz after contacting a sample((e)). The natural frequency in the torsion direction did not depend on the conditions and always stayed at around 417 kHz((c), (f)).



- Fig. 5 Torsion signal, the spectrum of the bending signal and that of the torsion signal at tip velocities of 11μ m/s and 23μ m/s. In the case where the tip velocity was 11μ m/s, crystal periodicity of about 47 kHz was observed in the spectrum of torsion signal ((c)). The periodicity did not appear in the spectrum of bending signal ((b)). A small hillock around 95 kHz in (c) implies that there was interference between bending signal and torsion signal. At the tip velocity of 23.3μ m/s, the periodicity was still observed in (d). However, the higher frequency signal corresponding to the natural frequency of the cantilever in the torsion direction started to mask the sawtoothed wave as the scanning velocity increased.
 - HOPGでは、走査速度が 10 μm/s 以上でも周期性を 観察でき、カンチレバーの機械的特性が周期性観察 の限界を決める.現状のカンチレバーでは 100,000 counts/s、約 25 μm/s が限界.
 - この相違は疎水性(HOPG)/親水性(マイカ)によ るものと考えている。

今後の課題としては、共振周波数が高くバネ定数の小さ いカンチレバーを開発すること、原子配列の方向と走査方 向を合わせた状態での観察を行うことが挙げられる. (2000年7月4日受理)

参考文献

- C. M. Mate, G. M. McClelland, R. Erlandsson and S. Chiang: Phys. Rev. Lett. 59 (1987) 1942.
- R. Erlandsson, G. Hadziioannou, C. M. Mate, G. M. McClelland and S. Chiang: J. Chem. Phys. 89 (1988) 5190.
- 3) J.-A. Ruan and B. Bhushan: J. Appl. Phys. 76 (1994) 5022.
- S. Fujisawa, E. Kishi, Y. Sugawara and S. Morita: Forces in Scanning Probe Methods ed. H.-J. Güntherodt et al. (Kluwer Academic Publishers, 1995) 313.
- D. F. Ogletree, J. Hu, X.-D. Xiao, C. Morant, Q. Dai, R. Vollmer, R. Carpick and M. Salmeron: Forces in Scanning Probe Methods ed. H.-J. Güntherodt et al. (Kluwer Academic Publishers, 1995) 337.
- S. Morita, S. Fujisawa, E. Kishi, M. Ohta H. Ueyama and Y. Sugawara: Thin Solid Films 273 (1996) 138.
- S. Fujisawa, Y. Sugawara and S. Morita: Jpn. J. Appl. Phys. 35 (1996) 5909.
- N. Sasaki, M. Tsukada and K. Kobayashi: Micro/Nanotribology and Its Applications ed. B. Bhushan (Kluwer Academic Publishers, 1997) 355.
- N. Sasaki, M. Tsukada, S. Fujisawa, Y. Sugawara, S. Morita and K. Kobayashi: Phys. Rev. B 57 (1998) 3785.
- R. M. Overney, H. Takano, M. Fujihira, E. Meyer and H.-J. Güntherodt: Thin Solid Films 240 (1994) 105.
- M. R. Sørensen, K. W. Jacobsen and P. Stoltze: Phys. Rev. B 53 (1996) 2101.
- V. N. Koinkar and B. Bhushan: J. Vac. Sci. & Tecnol. A 14 (1996) 2378.
- 13) Teschke and E. F. Souza: Rev. Sci. Instrum. 69 (1998) 3588.
- B. N. J. Persson: Micro/Nanotribology and Its Applications ed. B. Bhushan (Kluwer Academic Publishers, 1997) 555.
- R. Bennewitz, T. Gyalog, M. Guggisberg, M. Bammerlin, E. Meyer and H.-J. Güntherodt: Phys. Rev. B 60 (1999) R 11 301.